

Opis przedmiotu sprzedaży:

(Uszkodzony) skaningowy mikroskop elektronowy **JSM-5400** firmy **JEOL** wyposażony w:

- system akwizycji obrazów SEMAFORE 5.0
- system mikroanalizy rentgenowskiej EDS LINK L200 ISIS.

Rok produkcji: 1993;

Data i miejsce pierwszej instalacji 01.10.1993r. – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.

Dane techniczne (możliwości badawcze w stanie nieuszkodzonym):

Źródło wiązki elektronowej: katoda wolframowa typu K;

Obserwacje obrazów uzyskanych za pomocą elektronów wtórnych (SEI) i wstecznie odbitych (BEI – COMPO, TOPO i TOPO-COMPO);

- powiększenia mikroskopu: 15 do 200tys. razy;
- napięcie przyśpieszające elektrony: do 30kV;
- zdolność rozdzielcza: 4nm (30kV, tryb SEI);
- cyfrowa rejestracja obrazów z możliwością analizy obrazu (pomiar długości, kąta, pola powierzchni);

Zakres identyfikacji pierwiastków: od berylu do uranu;

Rodzaje analiz:

- jakościowa: rozkłady liniowe, mappingi;
- ilościowa: punktowa, w całym polu widzenia.

Opis uszkodzenia mikroskopu:

Po włączeniu głównego włącznika mikroskopu, zgodnie z wymaganiami, następuje uruchomienie układu próżniowego. Potwierdzeniem tego jest jedynie odgłos rotacyjnej pompy niskiej próżni. Nie wyświetlają się żadne komunikaty na ekranie monitora, ani wartości parametrów regulacyjnych mikroskopu na wyświetlaczu kontrolnym (monitor i wyświetlacz pozostają ciemne). W takim stanie praca na mikroskopie jest niemożliwa. Przyczyna (przyczyny) tego stanu jest nieznaną.